PAT-NO:

JP361238981A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 61238981 A

TITLE:

METHOD FOR MAKING UNIFORM HIGH-FREQUENCY ETCHING

PUBN-DATE:

October 24, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KIKUCHI, MASASHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

ULVAC CORP

N/A

APPL-NO:

JP60079251

APPL-DATE:

April 16, 1985

INT-CL (IPC): C23F001/00, H01L021/302

'US-CL-CURRENT: 216/63

ABSTRACT:

PURPOSE: To easily and uniformly etch the entire part of a substrate by providing a perforated flat plate in front of an anode and adjusting the distance from said plate and anode in such a manner as to be larger at the point where the rate of etching is low and to be smaller at the point where the rate thereof is high.

CONSTITUTION: The perforated flat plate 6 having the same potential as the potential of the flat plate-shaped anode 2 is placed in front of the anode 2 apart at a spacing therefrom in the stage of introducing gas such as CHF<SB>3</SB> under adequate low pressure into a vacuum chamber 1, providing the anode 2 and cathode 3 in parallel with each other, throwing electric power from a high-frequency power source 4 thereto and etching the substrate 5 provided to the cathode 3. The flat plate 6 disposed with the hole parts 6a in a zigzag shape, etc., is adjusted by a suitable means such as, for example, curving either the anode 2 or the flat plate 6 in such a manner as to increase the distance between the flat plate 6 and the anode 2 at the point where the etching rate of the substrate 5 is low and to decrease the above-mentioned distance at the point where the above-mentioned rate is high. The substrate 5 is etched uniformly over the entire part by adjusting partially the rate of etching according to the above-mentioned method.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-238981

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

③公開 昭和61年(1986)10月24日

C 23 F 1/00 H 01 L 21/302 6793-4K 8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

9発明の名称

高周波エッチングの均一化方法

②特 顧 昭60-79251

②出 願 昭60(1985)4月16日・

砂発明者 菊池

正 志 藤沢市長後1831

⑪出 願 人 日本真空技術株式会社

茅ケ崎市萩園2500番地

0代 理 人 弁理士 北村 欣一

外2名

86 **4**FF **4**

1. 発明の名称

高周波ェッチングの均一化方法

2. 特許額永の範囲

平板状の陽極と陰極を真空室内に、観隆極を真空室内に、観隆極を真破を記録を見せられて、観隆を高度を発送された。というとの場合を観ける。一般を表現している。との場合は、一般を表現を表現している。との場合は、一般を表現を表現している。

5. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は高周波電源に接続した電極にシリコンウェハ等の基板を取付け、これに均一にエッチングを施す方法に関する。

(従来の技術)

従来、基板に高周波電源によりエッチングす

ることは行なわれており、基板に施されるエッチングが不均一になると陽極と陰極の電極間距離を嵌えることも行なわれている。

(発明が解決しようとする問題点)

電極間距離を変えてエッチングの不均一を修正すると、調節したい個所以外のエッチング速度が変えられてしまうことが多く、基板全体を均一にエッチングするための調節が容易でない。本発明はエッチングの速度を簡単に部分的に調節して基板全体の均一なエッチングを行なう方法を提供することを目的とするものである。

(問題点を解決するための手段)

-419-

した。

(作用)

(突施例)

本発明の実施例を図面につき説明すると、額 1 図に於て(1)は真空宝、(2)(3)は該真空室(1)内に 互に平行して設けた平板状の陽極と陰極で、 数 陰極(3)は高周波電源(4)に接続され、陽震(2)はア

は終孔部 (6 a) に入り込む。 終孔部 (6 a) 内に於けるグロー放電は、終孔部 (6 a) の内接間を電子が 往復するために比較的強いグローになる。

またこの孔内に入り込んだグローは、多孔平板(6)の背後の空間に何もない場合、第2図 A に示すように孔部(6 s) を選して背後へと拡がりその強度も高くなるが、背後に第2図 B に示すように勝極(2)が接近して位置するとグローは孔部

(6 a) を通して拡がることがなくその強度も弱く かみ。

従って、例えば第 5 図示のように陽極(2)と機糖(3)間に配置した基板(5)の位置 『、』、』に於けるエッチングの速度が第 4 図に見られるように位置 』、』で次第に選くなる場合、第 1 図示のように多孔平板(6)をエッチング速度が遅くなる側が陽極(2)から大きく離れるように傾けて設置すれば、第 5 図示のように基板(5)の各位置 『、』のエッチングを均一化出来る。

尚、第 1 図示のエッチング装置に 於て降極(2)と 陰極(3)の距離は 1 5 mm であり、真空室(1)内には

ースに接続される。(5) は降価(3) に取付けした基板を示し、終其空室(1) 内を実空化して高間波電源(4) より電力を投入すると、陽価(3) と降価(3) の間でグロー放電が発生し、放電領域内で生じたイオンが降価(3) の基板(5) に突入してその表面をエッチングする。

験多孔平板(6)の幹細は第2図示の如くであり、 グロー放電(7)は例えば数多孔平板(6)の孔部(6 a) の口径が勝極シースの厚味 4 の 2 倍以上であれ

OHPa のガスを Q Q 7 5 Torrの 圧力に導入し、 高周波電力密度が Q 2 5 W/cdとなるように電源 (4)から電力を与え、多孔平板(6)には直径 5 mmの 孔部 (6 s)を 5 mm間隔で千鳥状に配列した。 陽極(2)と多孔平板(6)はそのいずれかを第 6 図又 は第 7 図示の如く舞曲させ、また幾種(3)を回転 させるように構成してもよい。

(毎頭の効果)

このように本発明によるときは、陽極の前面 に多孔平板を設け、これと陽極との距離をエッ チング速度の低い個所で大きく、速い個所では 小さく飼節するようにしたので簡単に基板全体 を均一にエッチングするように調節出来る効果 がある。

図面の簡単な説明

第1 図は本発明の実施例の説明線図、第2 図はゲロー放電状態の説明図、第5 図は一般的エッチング接世の説明線図、第4 図は第5 図のエッチング速度の線図、第5 図は第1 図示の場合のエッチング速度の線図、第6 図及び第1 図は

-420-

本発明の他の実施例の説明線図である。

(1)…真空室

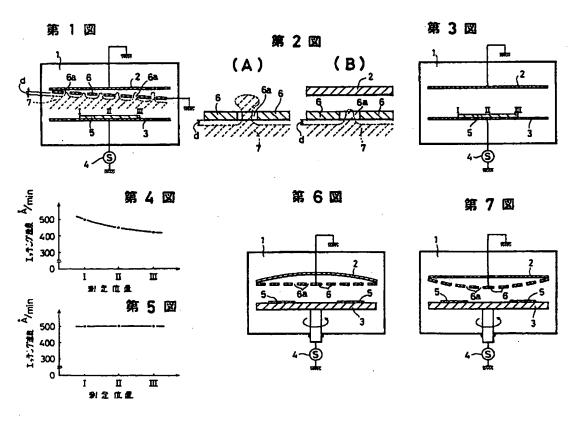
(2) … 陽 億

(3) … 険 惩

(4)…高周波電源

(5) … 荔板

(6)…多孔平板



-421-